# Application Note 具有密封配置的 BQ769X2 OTP 编程示例指南

# TEXAS INSTRUMENTS

Jie Wu

摘要

BQ76942(支持三节至10节串联电池)和BQ76952(支持三节至16节串联电池)是电池包中使用的电池监测器和保护器件。这两个器件集成了一次性可编程(OTP)存储器。将初始化设置写入OTP有助于在系统上电前保存初始化配置。用户需要在产品线上编写OTP。本应用手册逐步介绍了硬件设置和软件过程,可帮助用户节省完成OTP配置的时间。

L 1 - L1	
1 简介	2
2 硬件设置	2
3 CRC 和校验和编程及示例命令	3
3.1 CRC 计算示例	3
3.2 校验和计算示例	4
4 OTP 编程示例	4
4.1 配置进入密封模式的编程步骤	4
4.2 OTP 编程流程图	5
4.3 OTP 逐步命令示例	6
5 总结	7
6参考资料	7

内容

## 插图清单

图 2-1. OTP	9编程硬件设置方框图	2
图 3-1. CRC	<b>、</b> 软件示例代码	3
图 3-2. 具有	CRC 的写入命令格式	3
图 3-3. 读取	具有 CRC 的命令格式	3
图 3-4. 用于	校验和计算的软件编码	4
图 3-5. 具有	校验和及 CRC 的命令	4
图 4-1. OTP	) 进度流程图	5
		7

## 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。



## 1 简介

BQ769X2 器件可用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该器件的特性包括高精度监控电池电压、可配置的保 护功能、主机控制型电池平衡、内部温度感测和集成式 OTP 存储器。对于希望在产品线上永久配置器件参数的用 户,可以使用 OTP 存储器来存储一些关键参数。本应用手册重点逐步介绍了 OTP 编程,使设计流程更加简单。

## 2 硬件设置

在开始进行 OTP 配置之前,请注意 BQ769X2 电源; pack+ 和 pack- 之间的电压必须在约 10V-12V 的范围内。



图 2-1. OTP 编程硬件设置方框图



## 3 CRC 和校验和编程及示例命令

代码示例包括不同命令中的 CRC 计算和校验和计算。以下各节显示了相关软件代码示例和应用示例。

## 3.1 CRC 计算示例

图 3-1 显示了 CRC 软件编码示例。



图 3-1. CRC 软件示例代码

图 3-2 显示了一种写入命令格式,其中包括基于 I2C 通信的 CRC 计算。例如,将子命令 0x0022 (FET\_ENABLE 子命令)写入,并进行 CRC 计算。byte3 的 CRC 是针对 [0x10 0x3E 0x22] 计算的;CRC 计算结果为 0x63。第 二字节 [0x00] 的 CRC 为 0x00。相关的数据序列为 0x10 0x3E 0x22 0x63 0x00 0x00。

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5
Device address	Subcommand/Data memory read or write	Register Address MSB	CRC calculation result(Byte0~Byte2)	Register Address LSB	CRC calculation result(Byte4)
0x10	0x3E	0x22	0x63	0x00	0x00

#### 图 3-2. 具有 CRC 的写入命令格式

图 3-3 显示了包括 CRC 的读取命令格式。示例读取 0x14(VCell 1),回读日期为 0x0B68。在 CRC 计算中, byte4 的 CRC 是针对 [0x10 0x14 0x11 0x68] 计算;CRC 计算结果为 0x33。第二字节 [0x0B] 的 CRC 为 0x31。 相关的数据序列为 0x10 0x14 0x11 0x68 0x33 0x0B 0x31。

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6
Device address	Register to be read	Read command	Read back data MSB	CRC calculation result(Byte0~Byte3)	Read back data LSB	CRC calculation result(Byte5)
0x10	0x14	0x11	0x68	0x33	0x0B	0x31

图 3-3. 读取具有 CRC 的命令格式



## 3.2 校验和计算示例

图 3-4 显示了一个用于校验和计算的软件编码。

```
91 unsigned char Checksum(unsigned char *ptr, unsigned char len)
32// Calculates the checksum when writing to a RAM register. The checksum is the inverse of the sum of the bytes.
93 {
94
      unsigned char i;
      unsigned char checksum = 0;
95
96
      for (i = 0; i < len; i++) checksum += ptr[i];</pre>
37
38
99
      checksum = 0xff & ~checksum;
30
31
      return (checksum);
32 }
```

#### 图 3-4. 用于校验和计算的软件编码

图 3-5 显示了具有校验和格式的 I2C 命令示例。例如,将数据 0x8C 写入寄存器 0x9261,然后将校验和数据及长度写入 0x60/0x61。校验和是根据地址和数据 (0x61 0x92 0x8C) 计算。长度还包括器件地址 (0x10) 和子命令 (0x3E) 的两个字节,但不包括 CRC 字节,在本例中总长度为 5。

数据格式如下所示:

0x10 0x3E 0x61 0xAD 0x92 0xF7 0x8C 0xAD;

0x10 0x60 0x80 0xDE 0x05 0x1B;

	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
	Device address	Subcommand	Register Address MSB	CRC calculation result(Byte0~Byte2)	Register Address LSB	CRC calculation result(Byte4)	Data to write	CRC calculation result(Byte6)
	0x10	0x3E	0x61	0xAD	0x92	0xF7	0x8C	0xAD
ĺ	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5		
I	Device address	Checksum buffer	Checksum result	CRC calculation result(Byte0~Byte2)	Data length	CRC calculation result(Byte4)		
ĺ	0x10	0x60	0x80	0xDE	0x05	0x1B		

#### 图 3-5. 具有校验和及 CRC 的命令

## 4 OTP 编程示例

#### 4.1 配置进入密封模式的编程步骤

- 1. 通过读取其中一个已编程寄存器,检查器件上是否已完成 OTP 编程。通电时,寄存器报告默认值或 OTP 中编程的值(如果 OTP 已编程)。如果尚未完成 OTP 编程,则转至后续步骤。
- 2. 读取 0x12 电池状态 [SEC1,SEC0] 位,以验证器件是否处于完全访问模式 (0x01)。
- 3. 如果器件处于完全访问模式,则进入 CONFIG\_UPDATE 模式-(子命令 0x0090)。如果未进入该模式,请解 封器件,然后返回步骤二检查器件是否处于完全访问模式。
- 4. 在数据存储器中配置寄存器设置。
- 5. 退出 CONFIG\_UPDATE 模式 ( 子命令 0x0092 )。
- 6. 读取数据存储器寄存器以验证所有参数均已成功写入。
- 7. 进入 CONFIG\_UPDATE 模式。
- 8. 检查电池状态 [OTPB] 位是否清除,以验证是否满足 OTP 编程条件。
- 9. 读取 OTP\_WR\_CHECK() (子命令 0x00A0)。如果返回值为 0x80,则满足 OTP 编程条件。
- 10. 如果 OTP\_WR\_CHECK 指示满足条件,则发送 OTP\_WRITE() 子命令 (0x00A1)。
- 11. 等待 100 ms。从 0x40 读取以检查 OTP 编程是否成功 (0x80 表示成功)。
- 12. 进入密封模式。
- 13. 退出 CONFIG\_UPDATE 模式 ( 子命令 0x0092 )。

## 4.2 OTP 编程流程图

图 4-1 显示了器件进入密封模式所需进入的 OTP 编程流程。



图 4-1. OTP 进度流程图



## 4.3 OTP 逐步命令示例

- 1. 通过读取其中一个已编程寄存器,检查器件上是否已完成 OTP 编程。通电时,寄存器报告默认值或 OTP 中编程的值(如果 OTP 已编程)。如果尚未完成 OTP 编程,则转至后续步骤。
  - a. 示例:更改 0x9180 设置,然后可以读取 0x9180 寄存器,并检查该寄存器是否显示默认值。如果显示默认值,则进入下一步。
    - i. 0x10 0x3E 0x80 Byte3(CRC) 0x91 Byte5(CRC)。
  - ii. 0x10 0x40 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC)。
- 2. 读取 0x12 电池状态 [SEC1,SEC0] 位,以验证器件是否处于完全访问模式 (0x01)。
  - a. 读取 0x12 寄存器,如果 sec1=0, sec0=1,则器件处于完全访问模式。进入下一步。如果 sec1=1, sec0=1,则器件处于密封模式。用户需要先进入完全访问模式。
    - i. 0x10 0x12 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC).
  - b. 在读取数据存储器前 4 秒内进入完全访问模式。示例如下: Unseal\_Key\_Step1 0x1234; Unseal\_Key\_Step2 0x5678; FullAccess\_Key\_Step1 0x7856; FullAccess\_Key\_Step2 0x4321。
    - i. 0x10 0x3E 0x34 Byte3(CRC) 0x12 Byte5(CRC) ; //Write Unseal\_Key\_Step1。
    - ii. 0x10 0x3E 0x78 Byte3(CRC) 0x12 Byte5(CRC) ; //Write Unseal\_Key\_Step1。
    - iii. 0x10 0x12 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC); //Check Sec1 Sec0.
    - iv. 0x10 0x3E 0x56 Byte3(CRC) 0x12 Byte5(CRC) ; //Write Unseal Key Step1.
    - v. 0x10 0x3E 0x21 Byte3(CRC) 0x12 Byte5(CRC) ; //Write Unseal Key Step1.
    - vi. 0x10 0x12 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC); //Check Sec1 Sec0.
- 3. 如果器件处于完全访问模式,则进入 CONFIG\_UPDATE 模式-(子命令 0x0090)。
  - a. 通过写入子命令 0x0090 进入 CONFIG\_UPDATE 模式。
    - i. 0x10 0x3E 0x90 Byte3(CRC) 0x00 Byte4(CRC)
- 4. 在具有 CRC 和校验和的数据存储器中配置寄存器设置。
  - a. 将数据存储器配置为 0x9180 至 0x925D,如数据存储器 表中的 BQ76942 技术参考手册所示。
    - i. 0x10 0x3E 0x80 Byte3(CRC) 0x91 Byte5(CRC) Byte6(Wdata) Byte7(CRC) Byte8(Wdata) Byte8(CRC)。
    - ii. 0x10 0x60 Byte2(CheckSum) Byte3(CRC) Byte4(DataLength) Byte5(CRC)。
    - iii. 0x10 0x3E 0x82 Byte3(CRC) 0x91 Byte5(CRC) Byte6(Wdata) Byte7(CRC) Byte8(Wdata) Byte8(CRC)。
    - iv. 0x10 0x60 Byte2(CheckSum) Byte3(CRC) Byte4(DataLength) Byte5(CRC)。
    - v. 0x10 0x3E 0x5D Byte3(CRC) 0x92 Byte5(CRC) Byte6(Wdata) Byte7(CRC) Byte8(Wdata) Byte8(CRC)。
    - vi. 0x10 0x60 Byte2(CheckSum) Byte3(CRC) Byte4(DataLength) Byte5(CRC)。
- 5. 退出 CONFIG\_UPDATE 模式。
  - a. 通过写入子命令 0x0092 退出 Config\_Update 模式。
    - i. 0x10 0x3E 0X92 Byte3(CRC) 0x00 Byte5(CRC).
- 6. 读取数据存储器寄存器以验证所有参数均已成功写入。
  - a. 将数据存储器寄存器读取为 0x9180 至 0x925D, 如数据存储器表中的 BQ76942 技术参考手册所示。
    - i. 0x10 0x3E 0x80 Byte3(CRC) 0x91 Byte5(CRC)。
    - ii. 0x10 0x40 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC).
    - iii. 0x10 0x3E 0x82 Byte3(CRC) 0x91 Byte5(CRC)。
    - iv. 0x10 0x40 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC)。
    - v. 0x10 0x3E 0x5B Byte3(CRC) 0x92 Byte5(CRC).
    - vi. 0x10 0x40 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC)。
    - vii. 0x10 0x3E 0x5D Byte3(CRC) 0X92 Byte5(CRC)。
    - viii. 0x10 0x40 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC)。
- 7. 进入 CONFIG\_UPDATE 模式。
  - a. 通过写入子命令 0x0090 进入 CONFIG\_UPDATE 模式。
    - i. 0X10 0X3E 0X90 Byte3(CRC) 0X00 Byte5(CRC)。
- 8. 检查电池状态 [OTPB] 位是否清除,以验证是否满足 OTP 编程条件。

- a. 读取 0x12 寄存器,以获取 OTPB 位状态。
  - i. 0x10 0x12 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC).
- 9. 读取 OTP\_WR\_CHECK() (子命令 0x00A0)。如果返回值为 0x80,则满足 OTP 编程条件。
  - a. 写入子命令 0x00A0 并从 0x40 读取,以获取 0x00A0 的数据。
    - i. 0X10 0X3E 0XA0 Byte3(CRC) 0X00 Byte5(CRC).
    - ii. 0x10 0x40 0x11 0x80 Byte4(CRC).
- 10. 如果 OTP\_WR\_CHECK 指示满足条件,则发送 OTP\_WRITE() 子命令 (0x00A1)。
  - a. 写入子命令 0x00A1,以发送 OTP\_WRITE()。
    - i. 0x10 0x3E 0xA1 Byte3(CRC) 0X00 Byte5(CRC).
- 11. 等待 100 ms。从 0x40 读取以检查 OTP 编程是否成功 ( 0x80 表示成功 )。
  - a. 从 0x40 读回 0x00A1 子命令数据。
    - i. 0x10 0x40 0x11 0x80 Byte4(CRC).
- 12. 进入密封模式。
  - a. 写入 0x0030 进入密封模式,并读取 0x12 寄存器,以确保器件进入密封模式。
    - i. 0x10 0x3E 0x30 Byte3(CRC) 0x00 Byte5(CRC)。
    - ii. 0x10 0x12 0x11 Byte3(Rdata) Byte4(CRC) Byte5(Rdata) Byte6(CRC).
- 13. 退出 CONFIG\_UPDATE 模式 ( 子命令 0x0092 )。
  - a. 0x10 0x3E 0X92 Byte3(CRC) 0x00 Byte5(CRC).

## 5 总结

本应用手册逐步介绍了 BQ769X2 OTP 编程流程,还介绍了硬件设置和示例软件命令格式。通过参考本应用手册,用户可以有效地设置硬件和软件元素,以在产品线上完成 OTP 配置。

## 6 参考资料

- 1. 德州仪器 (TI), BQ769x2 校准和 OTP 编程指南,应用手册
- 2. 德州仪器 (TI), BQ76942 技术参考手册, 技术参考手册
- 3. 德州仪器 (TI), BQ769X2 软件开发指南,应用手册
- 4. 德州仪器 (TI), 基于 MSPM0 通过 I2C 的 BQ769X2 控制,应用手册
- 5. 德州仪器 (TI), BQ76952:无法退出密封模式, 网站

#### 重要通知和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。 严禁以其他方式对这些资源进行 复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索 赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 版权所有 © 2025,德州仪器 (TI) 公司